

平成 24 年 6 月 11 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 130 回研究会 開催通知

日時： 2012 年 7 月 18 日 (水) 13:00 ~ 17:00
会場： 明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 (3 階) 第 1・2 会議室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

テーマ 「シリコン結晶の点欠陥と不純物：注目される新たな評価解析技術」

世話人：金田 寛 (新潟大学)、鹿島一日兒 (コバレントシリコン (株))、
村上 進 ((株) 日立製作所)

プログラム

- 13:00~13:05 開会の挨拶 田島道夫
- 13:05~13:10 はじめに 鹿島一日兒
- 13:10~13:45 「低温超音波法によるシリコン原子空孔の研究：基礎と産業応用」
—その後の展開—
金田 寛 (新潟大学)
- 13:45~14:20 「単結晶 Si 育成中の点欠陥挙動に与える熱応力の影響」
末岡浩治 (岡山県立大学)
- 14:20~14:55 「点欠陥制御による Si ウェーハ技術」
仙田剛士 (コバレントシリコン (株))
- 14:55~15:15 休憩
- 15:15~15:50 「多結晶シリコン中の軽元素複合体による赤外吸収」
小野春彦 (神奈川県産業技術センター)
- 15:50~16:20 「アボガドロ国際プロジェクト」
—キログラム再定義における欠陥評価技術の役割—
藤井賢一 ((独) 産業技術総合研究所)
- 16:20~16:55 「放射光 X 線トポグラフィによる CZ シリコン結晶ネック部の非破壊 3 次元観察」
川戸清爾 (九州シンクロトロン光研究センター)
- 16:55~17:00 おわりに 村上 進
- 17:00~17:15 委員総会
- 17:20~19:30 懇親会 (場所：明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階 サロン燦)
以上